

# Vacuum test fixture VA 4040/F/H/PYLON-12

Article 114514



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Interface de test sous vide avec cassette sous vide serrant en parallèle.
- Version robuste, facile à entretenir, d'une longévité hors pair
- Confort d'utilisation accru, manipulation simple et intuitive
- Bonne accessibilité au boîtier avec grand angle d'ouverture
- Cassette sous vide rétrofittable individuellement pour une mise en contact à 2 niveaux
- Pour le montage des articles livrés non montés, les dessins des articles indiqués dans la liste de pièces doivent être utilisés.

## Utilisation

Les interfaces de test sous vide (VA) sont utilisées pour mettre en contact, de façon sûre en processus, des cartes électroniques en grands nombres et comptant peu de variantes.

## Version

- Plaque porte-contacts en FR4 invoilable épais de 10 mm
- Plaque d'applique en FR3 épais de 6 mm avec surface conductrice ESD, y compris 4 vis de verrouillage imperdables
- Accès sans outil à la plaque porte-contacts, pour un remplacement facile des pointes de test usagées
- Boîtier à ouvrir avec outil (TORX T20).
- Poignées étriers rabattables pour un transport sûr et confortable

## Livraison

La livraison a lieu de façon partiellement montée. Le boîtier est livré monté, la cassette sous vide est livrée non montée, avec les composants à travailler spécifiques à l'objet à tester.

## Données générales

Interface pour système de test:

Groupe de produits:

Série principale:

Sous-série:

Série:

Taille du type:

Type d'interface de test:

Génération de course de contact:

Type de boîtier:

Sens de mise en contact:

Force de contact max.:

Course de contact parallèle env.:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Gedis Pylône

Interface de test sous vide (VA)

VA xxxx

VA 40xx

VA 4040

xx40

Interface individuelle

vide

Boîtier plat

à 1 niveau / à 2 niveaux

16.000 N

12,8 mm

12,5 kg

10 °C

60 °C

oui

NEW



## Remarque :

Pour équiper professionnellement l'interface de test sous vide VA 40xx, le schéma d'équipement INFO 4630 est utilisé pour les équipements à 1 niveau, et le schéma INFO 4638 est utilisé pour les équipements à 2 niveaux.

## Caractéristiques techniques

Hauteur d'incorporation pointe de test en bas:	16 mm
Hauteur d'incorporation pointe de test à 2 niveaux en bas:	21,3 mm
Force of gas pressure springs:	400 N (200 N à gauche) / 200 N à droite)
Version standard:	oui
Surface utile standard (LxP):	460 x 340 mm
Version ESD:	non
Version haute fréquence:	non
Version à aiguille rigide:	non
Version à 2 niveaux:	oui, avec option supplémentaire adaptée
Surface utile à 2 niveaux (LxP):	435 x 340 mm
Mise en contact en haut (ZSK):	oui, avec option supplémentaire adaptée
Dimensions hors tout fermé (LxPxH):	575 x 510 x 167 mm

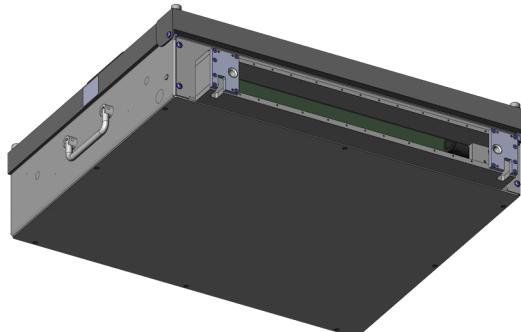
# Vacuum test fixture VA 4040/F/H/PYLON-12

Article 114514

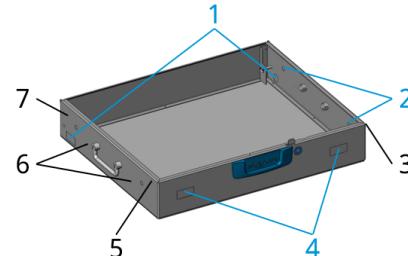


DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology



## Housing perforations and pilot holes



### Perforated for:

- 1. Cable connections
- 2. Additional handles
- 4. Stroke counter

### Prepared for:

- 3. ESD discharge button
- 5. Anti-pinch protection
- 6. Alum-A handles
- 7. Earthing contact

## Accessories

Part no.	Designation	Version
114715	FB-2VE-VA4040	Dual-stage shifting unit
100974	VD-V-4040-2	Vakuumdichtung außen
107048	VD-Z-21-300-200-2	Vacuum seal vacuum-free zone (fixed dimensions)
109501	VD-Z-21-XXX-XXX-2	Vacuum seal vacuum-free zone (variable dimensions)
31788	GDF-185-60-200N-A6-A6	Gas pressure spring
105791	FED-10,0-24,5-103N-11,6	Pressure spring
2599	HBS-03,0-10,0	Stroke-limiting disk
116613	EHZ-08-R-11-TR	Electric stroke counter
113481	FB-TWA	Alum-A transport bracket
17036	FB-ALS-VAxxxx-2S	ESD discharge probe
115943	MAP VA4040	Ground plate

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 11/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
Kits d'interface de test

